

Ισχύς του τεστ: $\gamma = 1 - \beta$

$$\gamma = 1 - \beta = 1 - P(\text{Σφ τ΄που II}) = 1 - P(\text{Αποδ } H_0 / H_0 \text{ αληθής})$$

$$\underline{\underline{P(A^c) = 1 - P(A)}} \quad P(\text{Απορρ } H_0 / H_0 \text{ αληθής})$$

Συμμετρία Προσπαθούμε να βρούμε την κ.π. έτσι ώστε για σταθερό και μικρό α (επίπεδο σημαντικότητας (ε.σ)) το β ελαχιστοποιείται ή η ισχύς γ μεγιστοποιείται

Ισχυρότατο του (I) - Ομοιομόρφως Ισχυρότατου (O.I) Τεστ

Ισχυρότατο Τεστ Έστω ο έλεγχος μιας απλής H_0 έναντι μιας απλής H_a .

Ισχυρότατο τεστ με ε.σ α ονομάζεται το τεστ με τη μεγαλύτερη ισχύ μεταξύ όλων των άλλων τεστ με ίδιο ε.σ.

Ομοιομόρφως Ισχυρότατο Έστω ο έλεγχος απλή ή σύνθετης H_0 έναντι σύνθετης H_a . Θεωρούμε ένα τεστ για τον έλεγχο αυτό και έστω $\gamma(\theta)$ η ισχύς του ως συνίστη του θ που υπακούει στην εναλλακτική υποθ. H_a . Το τεστ αυτό ονομάζεται O.I τεστ αν η ισχύς του $\gamma(\theta)$ είναι $\forall \theta$ μεγαλύτερη από την ισχύ οποιαδήποτε άλλου τεστ με ίδιο ε.σ.

Ερώτημα: Πώς κατασκευάζουμε I ή O.I τεστ;

Απ

Θεμελιώδες Λήμμα Neymann-Pearson

Έστω τ.σ x_1, \dots, x_n από πληθυσμό $f(x, \theta)$, $\theta \in \Theta$

Έστω πρόβλημα ελέγχου απλής H_0 έναντι απλής H_a

$H_0: \theta = \theta_0$ v $H_a: \theta = \theta_a$, $\theta_0, \theta_a \in \Theta$ γνωστά

Αν \exists μια κ.π G μεγέθους α και ένας σταθερός αριθμός $k > 0$ τ.ω

$$\frac{L_0}{L_a} = \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_0)}{\prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_a)} \leq k \quad \forall \underline{x} = (x_1, \dots, x_n) \in G$$

και $\frac{L_0}{L_a} \geq k \quad \forall \underline{x} \in S - G$ τότε η G είναι η \uparrow Ισχυρ. κ.π. μεγέθους α (ε.σ α) για τον έλεγχο της H_0 έναντι H_a

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ α) I-κη προκύπτει για μικρές τιμές του λόγου $\frac{L_0}{L_a}$ (γιατί?)

β) Το γιατί

$$\frac{L_0}{L_a} = \frac{\prod f(x_i, \theta_0)}{\prod f(x_i, \theta_a)} \approx \frac{P_{\theta_0}(x_{i-1} - \epsilon \leq X_i \leq x_{i+1} \epsilon, \dots, x_{n-1} - \epsilon \leq X_n \leq x_{n+1} \epsilon)}{P_{\theta_a}(x_{i-1} - \epsilon \leq X_i \leq x_{i+1} \epsilon, \dots, x_{n-1} - \epsilon \leq X_n \leq x_{n+1} \epsilon)}$$

Τότε μικρές τιμές $\frac{L_0}{L_a}$ σημαίνει $P_{\theta_0} \ll P_{\theta_a}$ ← πιθανότητα πραγματοποίησης δείγματος υπό H_0 .

↑
 πιθανότητα πραγματοποίησης δείγματος υπό H_a .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (Z-TEST)

Έστω τ.δ X_1, \dots, X_n από μια κανονική κατανομή $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 γνωστή
 Να κατασκευαστεί το I-τεστ με ε.δ α για τον έλεγχο $H_0: \mu = \mu_0$ έναντι $H_a: \mu = \mu_a$
 μ_0, μ_a γνωστά και $\mu_a > \mu_0$.

Βήμα 1 $L_0 = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_0) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu_0)^2}$

$\Rightarrow L_0 = \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu_0)^2}$

Όμοια η

$L_a = \prod f(x_i, \theta_a) = \prod \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu_a)^2}$

$\Rightarrow L_a = \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu_a)^2}$

$\frac{L_0}{L_a} \leq k \Rightarrow \frac{\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu_0)^2}}{\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu_a)^2}} \leq k$

$\Rightarrow e^{-\frac{1}{2\sigma^2} (\sum (x_i - \mu_0)^2 - \sum (x_i - \mu_a)^2)} \leq k$

$\Rightarrow \sum (x_i - \mu_a)^2 - \sum (x_i - \mu_0)^2 \leq 2\sigma^2 \log k$

$\Rightarrow \sum x_i^2 - 2\mu_a \sum x_i + n \cdot \mu_a^2 - \sum x_i^2 + 2\mu_0 \sum x_i - n \cdot \mu_0^2 \leq 2\sigma^2 \log k$

$\Rightarrow (2\mu_0 - 2\mu_a) \sum x_i \leq 2\sigma^2 \log k - n\mu_a^2 + n\mu_0^2$

$\Rightarrow n(2\mu_0 - 2\mu_a) \bar{x} \leq 2\sigma^2 \log k - n\mu_a^2 + n\mu_0^2$

$\xrightarrow{\mu_a > \mu_0} \bar{x} \geq \frac{2\sigma^2 \log k - n\mu_a^2 + n\mu_0^2}{2n(\mu_0 - \mu_a)} = k'$

$\mu_0 - \mu_a < 0$
 αλλάζει η
 ανισότητα

Άρα από Θεμ. Λήμμα N-P η I-κη μεθόδους α (με ε.δ α) είναι $\bar{x} > k'$

Πρόβλημα Δεν χωρίζω το K'

Πως θα το βρού? : Πάντα αμφισβητώντας την $P(\text{Σφ. τύπου I}) = \alpha$.

$$\alpha = P(\text{Σφ. τύπου I}) = P(\text{Απορ. } H_0 / H_0 \text{ αληθής}) = P(\bar{X} \geq K' / X_i \sim N(\mu_0, \sigma^2), \forall i=1, \dots, n)$$

$$= P(\bar{X} \geq K' / \bar{X} \sim N(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}))$$

$$\Rightarrow \alpha = P(\bar{X} \geq K' / \bar{X} \sim N(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}))$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq \frac{K' - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq \frac{K' - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \mid \bar{X} \sim N(\mu_0, \sigma^2)\right)$$

$$= P\left(Z \geq \frac{K' - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \mid Z \sim N(0,1)\right)$$

από ορισμό εναποσεισίων σημείων $N(0,1)$

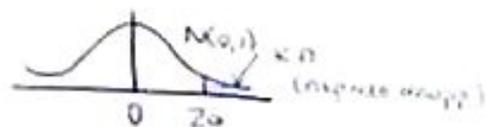
$$\frac{K' - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = Z_\alpha \Rightarrow K' = \mu_0 + Z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Συμμετρικά Η I-επι μέγεθος α για τον έλεγχο της $H_0: \mu = \mu_0$ έναντι $H_1: \mu > \mu_0$ είναι $\bar{X} \geq \mu_0 + Z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, αλλιώς για τον έλεγχο της $H_0: \mu = \mu_0$ έναντι $H_1: \mu < \mu_0$ η $Z \leq -Z_\alpha$ είναι \bar{X} με κατανομή $N(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n})$ υπό H_0 και κριτ μέγεθος α (με ε.σ. α) $\bar{X} \geq \mu_0 + Z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

ή

για τον έλεγχο $H_0: \mu = \mu_0$ έναντι $H_1: \mu < \mu_0$

η $Z \leq -Z_\alpha$ είναι $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ με κατανομή $N(0,1)$ υπό H_0 και κριτ μέγεθος α (με ε.σ. α) $Z \leq -Z_\alpha$



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ① Εφαρμογή του Θεμ. Λήμμα N-P

ΒΗΜΑΤΑ α) ξεκινά από $\frac{L_2}{L_1} \leq K$ και προσπαθεί να καταλήξει με πράξεις σε ένα στατιστικό (συνήθως έπαρσης) με γνωστή κατανομή υπό την H_0 β) Το κριτήριο σημείο K (ή $K', K'' \dots$) υπολογίζεται πάντα από

$$\alpha = P(\text{Απορ. } H_0 / H_0 \text{ αληθής})$$

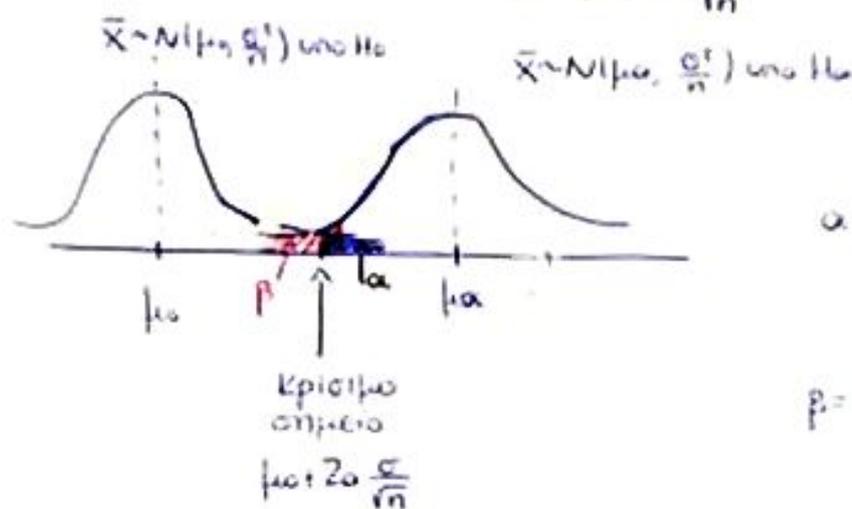
② Το I-επι που κατασκευάστηκε είναι γνωστό ως Z-TEST.

*) (Ανταρτίδειγμα)

Τα α, β δεν ελαχιστοποιούνται ταυτόχρονα

Για τον έλεγχο της $H_0: \mu = \mu_0$ έναντι $H_1: \mu = \mu_1$ ($\mu_1 > \mu_0$)

το I-έσος είναι $\bar{X} \geq \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$



$$\alpha = P(\text{Αρνη} H_0 / H_0 \text{ αληθ})$$

$$= P(\bar{X} \geq \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} / H_0 \text{ αληθ})$$

$$\beta = P(\text{αρνήσει} H_0 / H_1 \text{ αληθής})$$

$$= P(\bar{X} < \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} / H_1 \text{ αληθ})$$

Υπολογισμός Ισχύος για Z-έσος

$$\gamma = 1 - \beta = 1 - P(\text{Αρνή} H_0 / H_1 \text{ αληθής})$$

$$= P(\text{Αρνη} H_0 / H_1 \text{ αληθ})$$

$$= P(\bar{X} \geq \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mid X_i \sim N(\mu_1, \sigma^2), i=1, \dots, n)$$

$$= P(\bar{X} \geq \mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \mid \bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n}))$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} + \frac{(\mu_0 + Z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} \mid \bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n})\right)$$

$$= P\left(Z \geq Z_{\alpha} + \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$$= 1 - \beta = 1 - P\left(Z \leq Z_{\alpha} + \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$$= 1 - \underbrace{\Phi\left(Z_{\alpha} + \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}}\right)}_{\text{από τον Ν(0,1)}}$$

Άσκηση (3ημε) Έστω X_1, \dots, X_n από $N(\mu, \sigma^2)$ σ' γινώσκ. Να υποσχεθείτε το I-έσος με α για τον έλεγχο $H_0: \mu = \mu_0$ έναντι $H_1: \mu = \mu_1$ ($\mu_1 > \mu_0$)

Έλεγχος Απλής Μηδενικής Έναντι Σύθετης Εναλλακτικής (ΟΙ-τεστ)

Έστω τ.δ x_1, \dots, x_n από πληθυσμό $f(x, \theta), \theta \in \Theta$

Έστω απλή $H_0: \theta = \theta_0$ (θ_0 γνωστό) έναντι σύνθετης $H_a: \begin{cases} \theta > \theta_0 \\ \theta < \theta_0 \\ \theta \neq \theta_0 \end{cases}$

Έστω επίσης το Ι-τεστ για τον έλεγχο της απλής $H_0: \theta = \theta_0$ έναντι της απλής με θ_a να ικανοποιεί την $H_a: \begin{pmatrix} \text{σηλ} & \theta_a > \theta_0 \\ & \theta_a < \theta_0 \\ & \theta_a \neq \theta_0 \end{pmatrix}$ $H_a^*: \theta = \theta_a$

Είναι ίδιο $\forall \theta_a$ που ικανοποιεί την H_a ($\theta_a \in H_a$)

τότε το τεστ αυτό είναι και το ΟΙ-τεστ μεγέθους α (με ε.σ. α) για τον αρχικό έλεγχο της απλής H_0 έναντι της σύνθετης H_a

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Έστω τ.δ x_1, \dots, x_n από $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 γνωστό
Να κατασκευαστεί ΟΙ-τεστ με ε.σ. α για τον έλεγχο
 $H_0: \mu = \mu_0$ (μ_0 γνωστό) έναντι $H_a: \mu > \mu_0$.

Λύση

Θεωρούμε τον έλεγχο της απλής προς απλή
 $H_0: \mu = \mu_0$ έναντι $H_a^*: \mu = \mu_a$ ($\mu_a > \mu_0$)

Βρίσκουμε ότι το Ι-τεστ για τον έλεγχο της H_0 έναντι της H_a^* έχει
ΣΣΤ την $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ με κατανομή $N(0,1)$ υπο H_0
και κ.π. μεγέθους α την $Z \geq Z_{\alpha}$.

Παρατηρούμε ότι το Ι-τεστ δεν εξαρτάται από το μ_a

Άρα το Ι-τεστ είναι και το ΟΙ-τεστ για τον έλεγχο της απλής $H_0: \mu = \mu_0$ έναντι σύνθετης $H_a: \mu > \mu_0$.

Άσκηση (Σημύ)

Έστω τ.δ x_1, \dots, x_n από πληθυσμό με κατανομή $Exp(\lambda)$, $\lambda > 0$
($f(x, \lambda) = \lambda \cdot e^{-\lambda x}$, $x > 0, \lambda > 0$) Να κατασκευαστεί ΟΙ-τεστ για τον έλεγχο της
 $H_0: \lambda = \lambda_0$ (λ_0 γνωστό) έναντι $H_a: \lambda > \lambda_0$. (κατανομή του \bar{x})

Υπόδειξη (Θεωρούμε $H_0: \lambda = \lambda_0$ έναντι $H_a^*: \lambda = \lambda_a$ ($\lambda_a > \lambda_0$), θα βρούμε το Ι-τεστ. ($\frac{\lambda_0}{\lambda_a} \in K$)
Για τον έλεγχο H_0 έναντι H_a^* και αν αυτό είναι ανέλι το λ_a θα είναι και το ΟΙ-τεστ